

광학식 엔코더의 회절격자를 이용한 고정도 엔코더 개발

*홍정표, **손정기, ***원태현, *권순재, *홍순일, ****김종달
*부경대학교, **한국항공우주연구원, ***동의공업대학, ****동명대학

A Study on precision encoder design using diffraction grating

*J.P. Hong, **J.K. Son, ***T.H Won *S.J. Kwon, *S.I. Hong, ****J.D. Kim
*Pukyong national univ., **KPTI, ***Donggeui institute of technology, ****Tongmyong college

ABSTRACT

Position controls are very important in semiconductor manufacturing devices, machine tools precision measuring instruments, etc. In this paper, a novel encoder of digital and analog hybrid type is proposed. It is shown that from this experiment a high-resolution angle measurement device can be designed by a low cost incremental encoder.

1. 서 론

메카트로닉스 및 정밀공작기계의 발전으로 특히 산업용 정밀 머신 툴, 산업 로봇, 고정밀 위치제어 장치와 같은 미소 단위로 이동하는 물체의 이동 거리나 위치를 측정하며 고정밀도로 위치제어를 행하는 기기들의 위치 변위 검출에 대한 정확도는 제어기의 성능을 좌우하는 중요한 요소 중의 하나가 된다.

일반적으로 광학식 엔코더는 먼지나 외부환경에 영향을 받지만 고 분해능을 달성함에 있어 많은 장점이 있는 동시에 경제적인 면에서 자기식 엔코더에 비해 저렴한 장점으로 인하여 디지털화된 산업용기에 폭넓게 사용되고 있다.

일반적으로 로터리(Rotary) 광학식 엔코더는 동일 원주 상에 수많은 슬릿을 두고 외부에 발광부에서 발생하는 빛을 90°의 전기적 위상차가를 갖는 2개의 수광부를 두고 있다. 이러한 기존의 광학식 엔코더는 최대한 회절격자 수의 4배수에 해당하는 위치정보를 취할 수 있어서 위치정보의 분해능을 높이기 위해서는 슬릿의 수를 많게 하여야 하나 기계공작기술의 제약에 의해 그 한계가 있다. 본 논문에서는 기존의 저가형 광학식 엔코더의 전기적 회로 부분의 변형으로 디지털 신호 및 회절격자의 회절량에 대한 아날로그 신호를 기초로 하여 PC BASE로

고정도의 위치를 얻을 수 있는 새로운 방식의 위치 검출 기법을 제안하였다. 또한 실험을 통하여 그 타당성을 검증하였다.^[1]

2. 아날로그 디지털 혼합형 엔코더

2.1 기존의 광학식 엔코더

광학식 엔코더의 슬릿인 회절격자는 홈(Groove)이나 구멍(Aperture) 등이 주기적으로 배열되어 파의 위상이나 진폭에 주기적인 변화를 일으키게 하는 광학장치이다. 광학식 엔코더는 투광용 광원, 수광소자, 슬릿이 있는 회전 디스크의 3가지로 구성되어 있으며 회전 디스크를 투광용 광원과 수광소자의 중간에 넣어서 회전시키면 회전각에 비례한 펄스 출력을 얻을 수 있다. 그림 2.1은 광학식 엔코더의 구조를 나타내고 있다. 발광체로부터 투사된 광선은 회전 디스크의 슬릿과 고정 슬릿판의 슬릿을 통과하여 수광소자에서 검출된다. 이때 발광소자에서 발생하는 빛이 슬릿에 통과하면서 회절현상의 영향을 최소화하기 위해 그림 1에서와 같이 두 개의 슬릿을 사용하여 하나는 고정된 외함에 다른 하나는 회전판에 부착하여 사용한다.

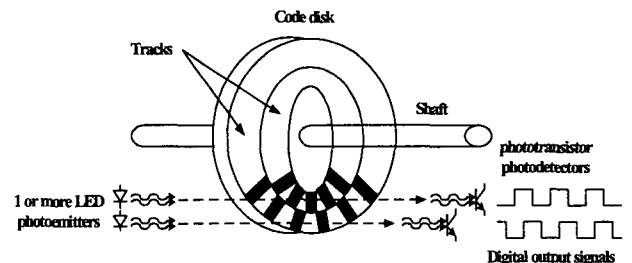


그림 1 광학 엔코더의 구조

두 개의 수광소자에 의해 검출된 신호를 일반적으로 A, B 상으로 정의되며, A, B상 신호로부터 엔코더의 분해능을 최대한 높이기 위해 4체배 회로를 사용하여 위치

검출용 카운터에 입력하게 된다. 엔코더의 A, B상 신호와 4체배회로의 원리는 그림 2에 나타나 있다.

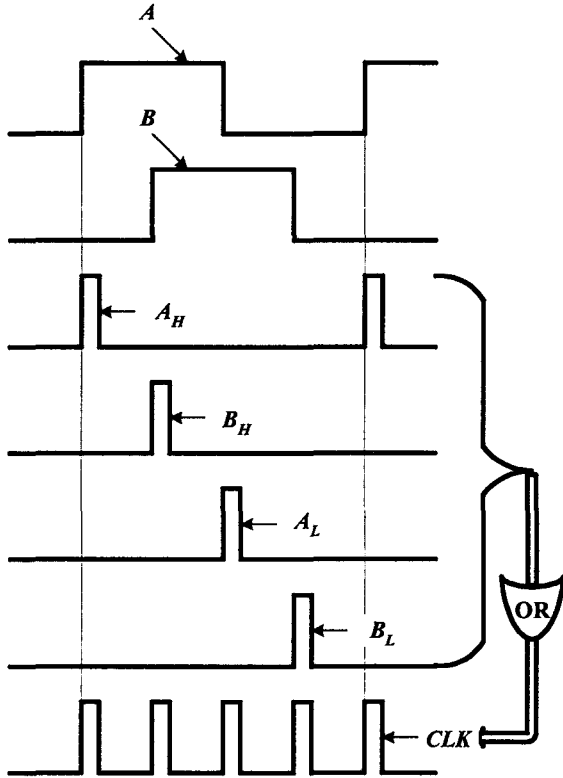


그림 2 엔코더의 상 신호와 4체배

그림 2에서 A_H, A_L, B_H, B_L 는 A, B상 신호의 상승 및 하강 에지신호를 나타내고, CLK 는 각 에지신호를 논리합의 신호를 나타내고 있다. CLK 는 위치를 나타내기 위한 카운터의 클럭으로 사용되며 A상의 전기각 9° 간격으로 CLK 의 한 주기가 나타나므로 4체배 회로가 된다.

그러나 실제로는 A, B 두 펄스의 위상차가 정확히 9° 가 되지 않고 어느 정도의 오차를 포함하고 있다. 그러나 4체배(Multiplication)를 하는 경우에는 이 위상차의 오차가 바로 속도의 오차로 나타나게 된다. 특히 저속에서는 단지 몇 개의 펄스만으로 속도를 측정하게 되는데 4체배를 하는 경우 펄스의 위상 오차에 비례하여 측정오차가 커지게 된다.

일반적으로 전동기에 부착된 엔코더로부터 펄스 신호를 가져올 때 잡음의 차단과 절연을 위해 광결합 소자(Opto-coupler)를 사용하고 있다. 이 소자는 대체로 상승 시간(Rising time)과 하강 시간(Falling time)이 다르므로 A, B 펄스의 상승 모서리와 하강 모서리를 사용하여 속도를 측정하는데 있어서 오차를 발생시키는 주요한 요인이 된다. 엔코더에서 발생하는 펄스의 수가 충분한 고속의 경우에는 충분히 많은 펄스수가 존재하기 때문에 속도 측정에 미치는 영향을 무시할 수도 있다. 그러나 펄스 수가 적은 저속 영역에서는 이러한 오차들이 속도 측정에 미치는 영향을 무시할 수 없게 되며 오히려 4체배

를 하지 않는 것이 더 좋을 수도 있다.

2.2 회전격자의 위치에 따른 수광 특성

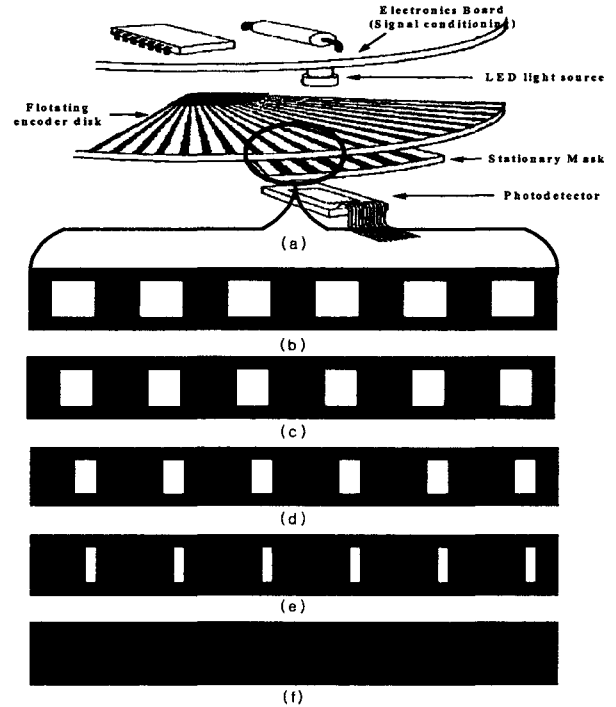


그림 3 슬롯의 전기적 위치에 따른 수광부 파형

그림 3은 2층 형태의 슬릿 구조와 슬릿의 전기적 위치에 따라 발광소자의 빛이 수광소자로 통과하는 단면적을 나타내고 있으며 그림 4는 그 때의 수광소자의 출력전압을 나타내고 있다.

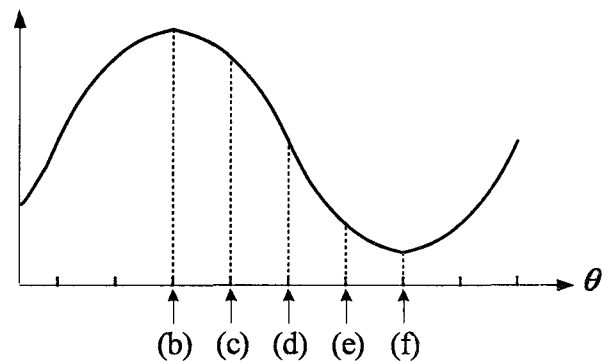


그림 4 슬릿의 전기적 위치에 따른 수광부 파형

그림 3의 (b)그림은 상하 슬릿의 상차각이 0° 일 때이며 이때 투과하는 빛의 양이 제일 많으며 그림 4의 출력전압이 가장 큰 b점이 된다. 슬릿의 위상차가 180° 내에서 커짐에 따라 투과하는 빛의 양은 감소하게 되고 그림 3의 제일 하단 (f)그림은 슬릿의 위상차가 180° 에서는 투과하는 빛의 양은 영이 되며 그림 4의 출력전압이 가장 적은 f점이 된다.

2.3 제안된 아날로그 디지털 혼합형 엔코더

기존의 디지털 타입 엔크리멘터 엔코더는 두 수광소자의 출력을 비교한 디지털화 된 값을 사용한다. 그림 5는 회전체의 위치에 따른 엔코더의 A, B상과 4체배한 신호 및 수광소자의 출력 파형을 나타내고 있다.

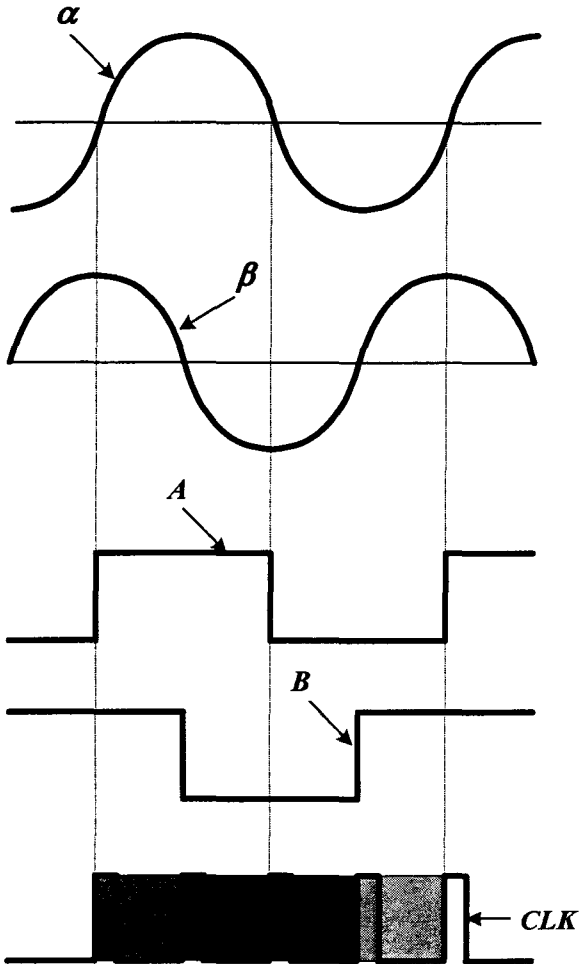


그림 5 위치에 따른 엔코더의 A상, B상, 4체배 한 신호 및 수광소자의 출력

일반적인 엔코더에서는 그림 5와 같이 회전체의 회전 방향 검출 및 분해능을 높이기 위해 전기각 90°의 위치차를 갖는 두 개의 수광부를 갖고 있어 두 개의 수광부의 아날로그 신호를 이용하면 슬릿내의 위치를 구할 수 있다. 그림 5의 A, B상 신호는 기존 엔코더의 디지털 출력신호이다. 엔코더의 한 회전당 펄스 수를 N이라 하면 체배를 행하지 않은 엔코더의 분해능은 아래와 같이 슬릿 수에 반비례한다.

$$n = \frac{2\pi}{N} \quad [\text{rad}] \quad (1)$$

엔코더의 A상 신호를 카운팅 한 값을 P라하면 현재의 회전자 각도는 아래와 같다.

$$\theta_i = \frac{2\pi}{N} P \quad [\text{rad}] \quad (2)$$

기존의 디지털 출력신호인 A, B상을 만들기 전의 신호인 수광소자의 출력을 각각 α , β 라 하면 두 신호는 위상차 90°를 갖는 2상 전압이 된다. 실제 수광소자의 출력은 직류 성분을 가지므로 외부회로를 사용하거나 프로세서를 사용하여 이를 제거하여야 된다. 이 2상 전압에서 슬릿 한 피치에 대한 위상각은 전동기의 정지 2상 좌표계에 사용한 기법을 이용하면 다음과 같이 쉽게 구할 수 있다.

$$\Delta\theta_E = \tan^{-1}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \quad (3)$$

식 (3)에 의해 슬릿내의 위상차($\Delta\theta_E$)를 취할 경우 atan의 값이 -90°에서 수광소자의 출력을 각각 α , β 라 하면 두 신호는 위상차 90°를 갖는 2상 전압이 된다. 이 2상 전압에서 슬릿의 한 피치내의 위상차를 계산할 수 있다. 위치각을 식 (3)에 의해 계산할 경우 α 가 영(zero) 부근에서는 노이즈에 의한 위치각 오차가 크게 나타나게 된다. 이를 보강하기 위해서 식 (4)와 같은 식을 사용한다.

$$\Delta\theta_E = \cos^{-1}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}\right) \quad (4)$$

식 (4)의 계산은 일반적으로 프로세서에 의해 계산되며 그 분해능은 프로세서에 장착된 A/D 컨버터의 비트 수에 의해 결정된다. A/D 컨버터의 비트 수를 Q라 하면 기계적 위치 분해능은 식 (5)과 같이 결정된다.

$$r = \frac{2\pi}{N \cdot 2^Q} \quad (5)$$

식 (4)에서 구한 슬릿내의 위상차는 한 슬릿 간격에 대한 위상이므로 기계적 위치 변위는 다음 식으로 구한다.

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{N} \Delta\theta_E \quad (6)$$

슬릿의 한 피치내의 위치각을 식 (6)로 구하면 엔코더의 A상 펄스신호를 카운팅한 값과 조합하면 기계적 위치각을 구할 수 있다. 실제 회전자의 정확한 위치각은 디지털 엔코더 신호에 의한 위치각 θ_i 와 슬릿 내의 위치각인 $\Delta\theta$ 의 조합에 의해 아래와 같이 구할 수 있다.

$$\theta = \theta_i + \Delta\theta \quad [\text{CW}]$$

$$\theta = \theta_i + \theta_k - \Delta\theta \quad [\text{CCW}] \quad (7)$$

여기서 θ_k 는 슬릿 한 피치의 기계각 이다.

따라서 디지털 신호와 아날로그 신호의 조합에 의한 엔코더의 분해능은 아날로그 신호에 의해 얻어진 슬릿내의 위치 변위에 의해 결정된다.

또한 그림 6과 같이 정확한 90°위상차가 나지않을 경우 다음과 같이 위상변위를 보상해준다

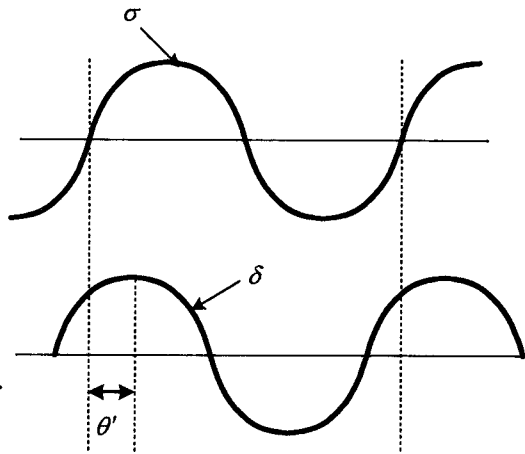


그림 6 off_set을 제거한 수광소자의 출력

위상차가 90°의 위상차가 나지 않는다면 σ 와 δ 는 다음과 같이 들 수 있다.

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \sigma \\ \cos(\theta - \theta') &= \delta \end{aligned} \quad (8)$$

여기서 σ , δ 는 직류성분제거한 신호

식 (8)을 이용해서 $\cos \theta$ 를 구해보면 식 (9)와 같이 됨을 볼 수 있다.

$$\cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' = \delta$$

$$\cos \theta \cos \theta' + \sigma \sin \theta' = \delta$$

$$\cos \theta \cos \theta' = \delta - \sigma \sin \theta'$$

$$\cos \theta = \frac{\delta - \sigma \sin \theta'}{\cos \theta'} \quad (9)$$

또한 노이즈 성분을 제거하기 위해 로페스 필터(LPF)를 통과시키고, 식 (4)에 의해 슬릿사이의 전기적 위상각을 검출하고 식 (6)에 의해 슬릿 사이의 위상변위를 계산한다. 슬릿사이의 위치각 변위($\Delta\theta$)과 디지털 엔코더의 회전자 위치각 θ_i 를 합하여 고정도의 회전자 위치각(θ)를 계산한다.

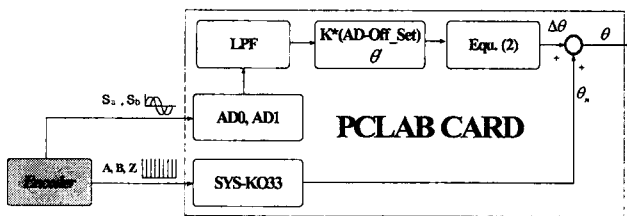


그림 7 검출 블록도

그림 7은 제안된 아날로그 디지털 혼합형 엔코더의 검출 블록도를 나타내고 있다. SYS-KO33 CARD을 통해 기존의 디지털 엔코더 신호를 받고, A/D단자를 통해 슬릿내의 위치 변위를 검출하기 위해 아날로그 신호를 받는다. 90°위상차를 갖는 두 아날로그 신호(a, b)는 온도나 먼지 등의 주위 환경변화에 의해 직류 성분 및 크

기에 영향을 받는다.

3. 실험결과

본 논문에서 제안한 아날로그 디지털 혼합형 엔코더의 타당성을 검증하기 위하여 기존의 저가형 엔코더인 오토닉스사의 1024펄스형 엔코더 안에 아날로그 증폭기를 장착하였으며 PCLAB CARD내의 A/D를 사용하였으며 노이즈의 영향을 제거하기 위해 상위 8 Bit를 사용함으로써 기존의 엔코더에 비하여 256배의 고정도를 가지는 위치 검출기를 실현하였다.

실제 실험에서는 엔코더에서 나오는 수광부 출력의 크기와 위상차의 변화에 따른 출력 파형을 보여준다. 각 출력 파형에서 나타내는 변수의 의미는 S_a , S_b 는 엔코더 수광부의 출력센서 신호이고 a,b는 센서신호의 필터링 신호이고 σ , δ 는 필터링 신호에서 엔코더의 직류성분을 제거한 신호가 된다. 그리고 α , β 는 σ , δ 신호에서 위상과 크기를 보상한 신호가 된다. 그림 8은 로페스 필터를 통과한 엔코더 아날로그 출력 파형이다. 차단 주파수를 100[Hz]에서 1.6[kHz]까지 변화 시키면서 필터의 특성을 살펴 본 것으로 주파수가 1.6[kHz]에서 가장 적당한 필터로 사용됨을 볼 수 있다. 따라서 본 논문에서는 1.6[kHz]의 차단주파수를 사용했다.

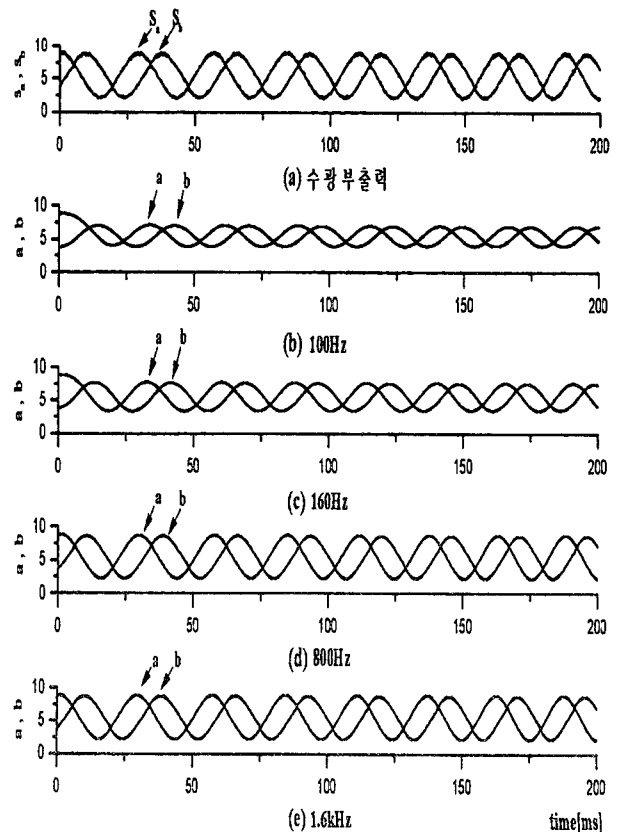


그림 8 로페스 필터를 통과한 수광부 출력 신호

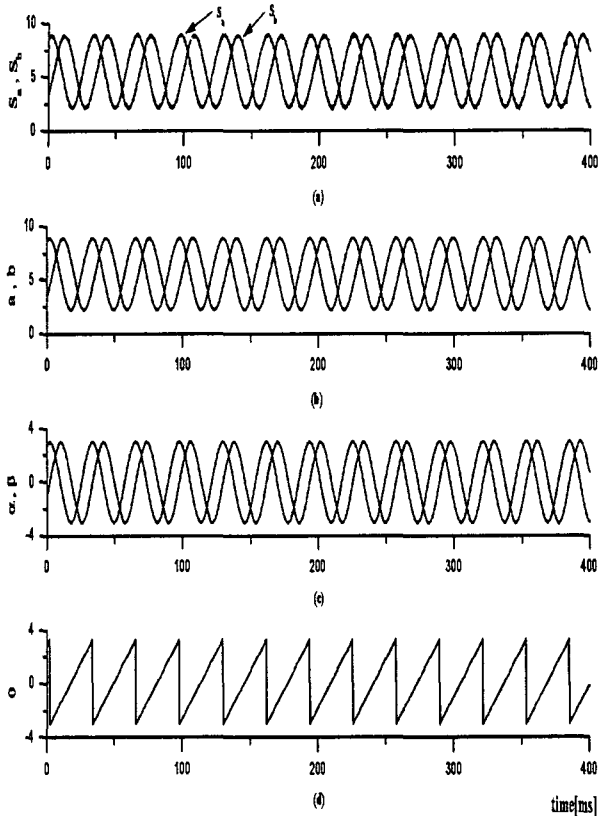


그림 9 위상과 크기가 같은 엔코더 수광소자 각부 출력 파형

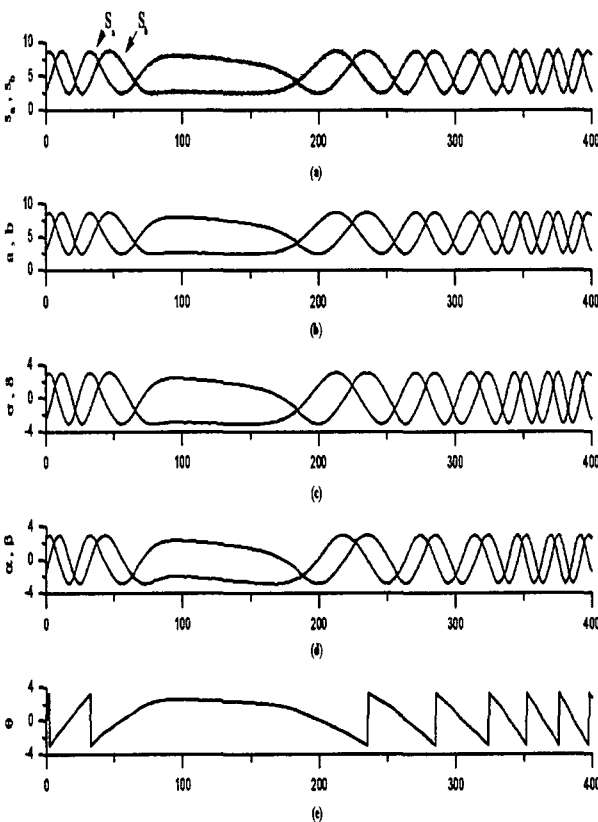


그림 10 크기가 동일하고 위상이 다른 수광소자 각부 출력 파형

그림 9은 엔코더의 특성을 살피기 위한 실험 파형으로 어느정도 일정한 크기와 위상을 가진 엔코더 수광부 출력 파형이다. 수광소자의 출력파형 S_a , S_b 는 크기가 일정하고 90° 의 위상차를 갖고 있으나 직류 성분을 포함하고 있으며 그 크기에도 다소 차이가 발생하고 있음을 알 수 있다. 그림 10은 크기가 동일하고 위상차가 다른 수광소자의 출력 파형이다.

4. 결 론

본 연구는 반도체 제조장치등에 사용되는 고정밀도로 위치제어기기에서 높은 정확도를 요구하는 변위량 검출을 위해서 기존의 저가형 광학식 엔코더의 전기적회로 부분의 변형으로 디지털 신호 및 회절격자의 회절량에 대한 아날로그 신호를 기초로 하여 고정도의 위치를 얻을 수 있는 새로운 방식의 위치 검출기법을 제안하였다. 제안된 방법에 의해 실험을 행한 결과 엔코더의 한 슬릿 내의 위치 변위를 얻을 수 있었다. 슬릿 내의 위치 변위 분해능은 노이즈를 무시한다면 A/D 컨버터의 Bit수에 의해 결정된다.

본 실험에서는 PCLAB CARD내의 A/D 를 사용하였으며 노이즈의 영향을 제거하기 위해 상위 8 Bit를 사용함으로써 기존의 저가형 엔코더(1024)에 비하여 256배의 고정도를 갖는 위치 검출기를 실현하였다. 하지만 전체 출력 파형을 살펴 보면 아직까지 노이즈의 대책이 필요함을 느낄 수 있고 수학적으로 해결된 부분에서는 관측기와 같은 적당한 제어기를 사용함으로써 월등한 출력을 얻을수 있음을 생각할 수 있었다.

참 고 문 헌

- [1] J. R. Rene Mayer, Optical Encoder Displacement Sensors, "Measurement Instrument and Sensors Handbook", CRC press LLC, 1999.
- [2] W. Zhou and L. Cai, "A positioning method for hard disk servowriter using an auto focus laser encoder", Proceedings of the IEEE/ASME, International Conference pp. 922-925 sept. 1999.
- [3] 박성준, 추영배, 박한웅, 안진우, 권순재, 김철우, "저가형 엔코더를 이용한 SRM의 안정운전에 관한 연구", 전력전자학술대회 논문집, pp. 17. 5~178, 1999
- [4] J. Akedo, Y. Kato, and H. Kobayashi, "High-Precision detection method for the reference position in an optical encoder", Applied optics, vol. 32, no. 3, May 1993.
- [5] K. Engelhardt and Peter Seitz, "High-resolution optical position encoder with large mounting tolerances", Applied Optics vol. 36, no. 13, pp. 2912-2916, May 1997.
- [6] "센서 핸드북(Sensor handbook)", 세화출판사, pp. 48 3-490, 1990